

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 43 25 724 A 1

51 Int. Cl.⁶:
G 01 N 23/00
G 02 B 21/00
A 61 B 10/00
H 01 J 37/256
A 61 N 5/10
G 01 N 21/00
G 01 N 21/17
G 01 N 21/62
A 61 B 6/00
A 61 N 5/06

21 Aktenzeichen: P 43 25 724.0
22 Anmeldetag: 30. 7. 93
43 Offenlegungstag: 2. 2. 95

71 Anmelder:
Debbage, Paul, Dr., 86415 Mering, DE

74 Vertreter:
Tetzner, M., Dipl.-Ing.-Univ., Pat.-Anw.; Tetzner, V.,
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Dr.jur., Pat.- u. Rechtsanw., 81479
München

72 Erfinder:
gleich Anmelder

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE	41 28 744 C1
DE	34 39 287 C2
DE	28 29 516 C2
DE	27 43 009 C2
DE	41 38 111 A1
DE	40 26 821 A1
DE	39 08 928 A1

DE	38 20 862 A1
DE	36 36 506 A1
DE	33 19 203 A1
DE	30 40 831 A1
DE	29 53 050 A1
DE	92 02 539 U1
US	50 57 102
US	50 08 907
US	49 95 068
US	48 15 448
US	44 23 736
US	37 94 840
EP	04 68 255 A2
WO	91 10 473
SU	5 53 766
SU	4 05 236

JP 63-300942 A. In: Patents Abstracts of Japan,
P-850, March 31 1989, Vol.13, No.131;

54 Vorrichtung und Verfahren zur Untersuchung eines Objektes und zur Einwirkung auf das Objekt

57 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung eines Objekts und zur Einwirkung auf das Objekt, wobei die von einem Objekt ausgehende Strahlung von einem Detektor empfangen wird, der ein entsprechendes Detektorsignal erzeugt. Dieses Detektorsignal wird derart weiterverarbeitet, daß eine nicht fokussierende Einrichtung zur gerichteten Bestrahlung der Teilfläche des Objekts in Abhängigkeit vom Detektorsignal angesteuert werden kann.

DE 43 25 724 A 1

DE 43 25 724 A 1